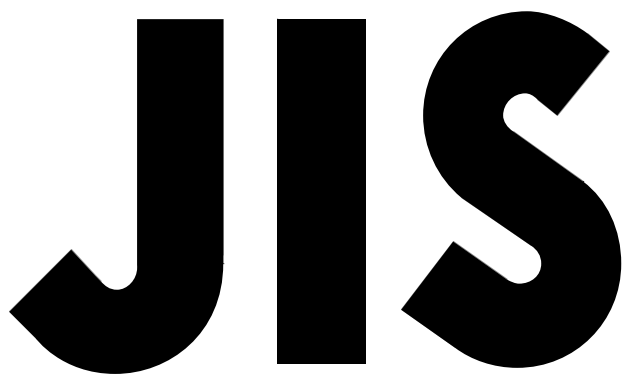




真空計校正方法

JIS Z 8750 : 2009

(AIST/VSJ)

平成 21 年 3 月 20 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準部会 基本技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	今 井 秀 孝	独立行政法人産業技術総合研究所
(委員)	大 井 みさほ	東京学芸大学名誉教授
	尾 島 善 一	東京理科大学
	加 藤 久 明	日本デザイン学会
	吉 良 雅 治	社団法人日本産業機械工業会
	小松原 仁	財団法人日本色彩研究所
	近 藤 良太郎	社団法人日本電機工業会
	田 森 行 男	財団法人日本品質保証機構
	徳 岡 直 静	慶應義塾大学
	八 田 勲	財団法人日本規格協会
	八 木 隆 義	社団法人日本鉄鋼連盟
(専門委員)	野 原 慈 久	財団法人日本規格協会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 37.6.1 改正：平成 21.3.20

官 報 公 示：平成 21.3.23

原 案 作 成 者：独立行政法人産業技術総合研究所

(〒305-8563 茨城県つくば市梅園 1-1-1 TEL 029-862-6221)

日本真空協会

(〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 TEL 03-3431-4395)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会 (部会長 二瓶 好正)

審議専門委員会：基本技術専門委員会 (委員長 今井 秀孝)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット産業基盤標準化推進室 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文.....	1
1 適用範囲.....	1
2 引用規格.....	1
3 用語及び定義.....	2
4 量記号, 記号及び略号.....	4
5 一般原則.....	4
6 要求事項.....	4
6.1 校正容器の設計.....	4
6.2 真空計の取付配管.....	5
6.3 排気系及び気体導入系.....	6
6.4 校正気体.....	6
6.5 温度計及び環境条件.....	6
6.6 参照真空計.....	6
7 校正.....	7
7.1 手順.....	7
7.2 測定の評価.....	8
7.3 測定の不確かさ.....	8
8 校正証明書.....	9
附属書 A (参考) 校正システムの構成の一例.....	11
附属書 B (参考) 校正上の注意点.....	12
附属書 JA (参考) JIS と対応する国際規格との対比表.....	15
解 説.....	17

まえがき

この規格は、工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき、独立行政法人産業技術総合研究所(AIST)及び日本真空協会(VSJ)から工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって、**JIS Z 8750:1994** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について、責任はもたない。

真空計校正方法

Methods of calibration for vacuum gauges

序文

この規格は、2005 年に第 1 版として発行された **ISO/TS 3567** を基に、技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。変更の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JA** に示す。

1 適用範囲

この規格は、参照真空計との直接比較による真空計の校正方法について規定する。この規格は、適切な校正を行うために満たすべき物理的、技術的及び計測学的条件を規定している。この規格に規定した条件によって適切に真空計の校正をするための装置の設計指針を示す。

真空計は、測定子、ケーブル、制御計測部、信号読出し装置など幾つかの部分から構成され、これらの装置全体を被校正真空計とする。測定子だけを校正する場合、他のすべての装置の種類又は条件を記録して、校正された測定子の使用者が校正時と同じ状態で測定できるようにする。

参照真空計は、国家標準又は一次標準にトレーサブルな真空計（通常の場合）、又は SI トレーサブルで不確かさの付いた絶対真空計（まれな場合）を使用する。

この規格は、参照真空計又は被校正真空計として特定の真空計についての使用方法などを規定するものではない。この規格で取り扱う真空計の校正圧力範囲は 10^{-6} Pa～110 kPa を規定するが、実際に適用できる範囲は使用する校正装置の性能又は参照真空計の種類に依存する。

注記 1 この規格は、一般的な真空環境の作製方法及び測定方法に精通している者を対象とする。

注記 2 国家標準又は一次標準にトレーサブルな真空計には、通常 **JIS Q 17025** の **5.10**（結果の報告）に従った証明書が付加されている。

注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO/TS 3567:2005, Vacuum gauges—Calibration by direct comparison with a reference gauge (MOD)

なお、対応の程度を表す記号(MOD)は、**ISO/IEC Guide 21** に基づき、修正していることを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項